

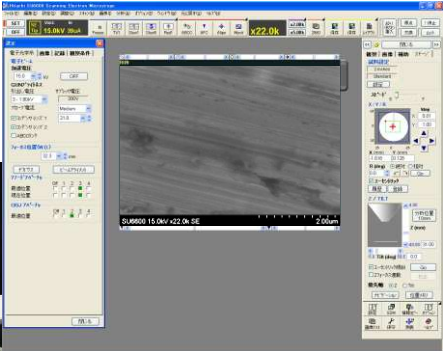


工業総合研究所所有装置

名称	走査型電子顕微鏡(エネルギー分散型エックス線分析装置附属)	メーカー	日立製作所	型式	SU6600 + EMAX EX250 X-act	取得	H23
概要	人間の目では約0.1mmまで見えますが、この装置ではミリメートルからナノメートルまでの表面観察ができます。エックス線分析装置も付属されており、自由に指定できる領域に含まれる元素も調べることができます。						
応用事例	<ul style="list-style-type: none"> 光学顕微鏡では見えにくい表面構造を超高倍率で観察 微小物体の表面観察と含まれている元素の分析(微小な付着物も可能) 金属メッキの断面の観察(メッキ界面の確認や膜厚の測定)[試料の作製が必要] 						
主な仕様	電子顕微鏡(冷陰極電界放出型):分解能1.2nm、加速電圧0.5~30kV X線分析装置(エネルギー分散型、堀場製作所、EMAX EX250 X-act):検出元素 Be~U、定性分析、定量分析(ZAF法)、点分析、線分析、元素マッピング						
測定時間	低解像度画像保存に約5秒 高解像度画像保存に約40秒 元素分析1箇所約300秒	 <p>↓電子顕微鏡と操作PC</p>  <p>↑観察の様子</p> 					
出力形態	画面に表示、印刷物、元素分析結果 (Word形式)、画像(jpg,tiff,bmp)						
試料等の制約	次の場合は、ご相談ください。 <ul style="list-style-type: none"> Φ2.54cmより大きい試料 水分を含む試料 高倍率での非導電性試料の観察 試料の元素分析 その他、お気軽にご相談ください。 						
使用料 手数料	機器貸出: 7,700円/時間 依頼試験: 走査型電子顕微鏡による観察 14,150円/1件・写真撮影5枚まで、写真枚数6枚目以降 2,350円/1枚 エネルギー分散型エックス線分析装置による分析(定性) 17,150円/1件、1か所の測定、 2か所目以降5,900円/1か所						
お問い合わせ 工業総合研究所 技術支援部							
TEL: 017-728-0900, FAX: 017-728-0903 e-mail: kou_souken@aomori-itc.or.jp							